

【物理・計測】

電気的変量の測定に関する 技術の特許マップ

出願人別件数推移時系列マップ	1
発明者別件数推移時系列マップ	2
Fターム件数ランキングマップ	3
出願人vs. Fタームマトリクスマップ	4
IPC分類vs. Fタームマトリクスマップ	5

特許マップ作成方法

テーマに関するIPC分類、FI、Fターム、キーワード等によりマップ作成対象となる母集団を抽出¹

上記母集団について、インパテック(株)の特許マップソフト「パテントマップEXZ」により特許マップを作成(さらにJSTにて編集・加工)

- J-STORE掲載特許² 107件
- 日本国内(大学等)出願特許³ 749件

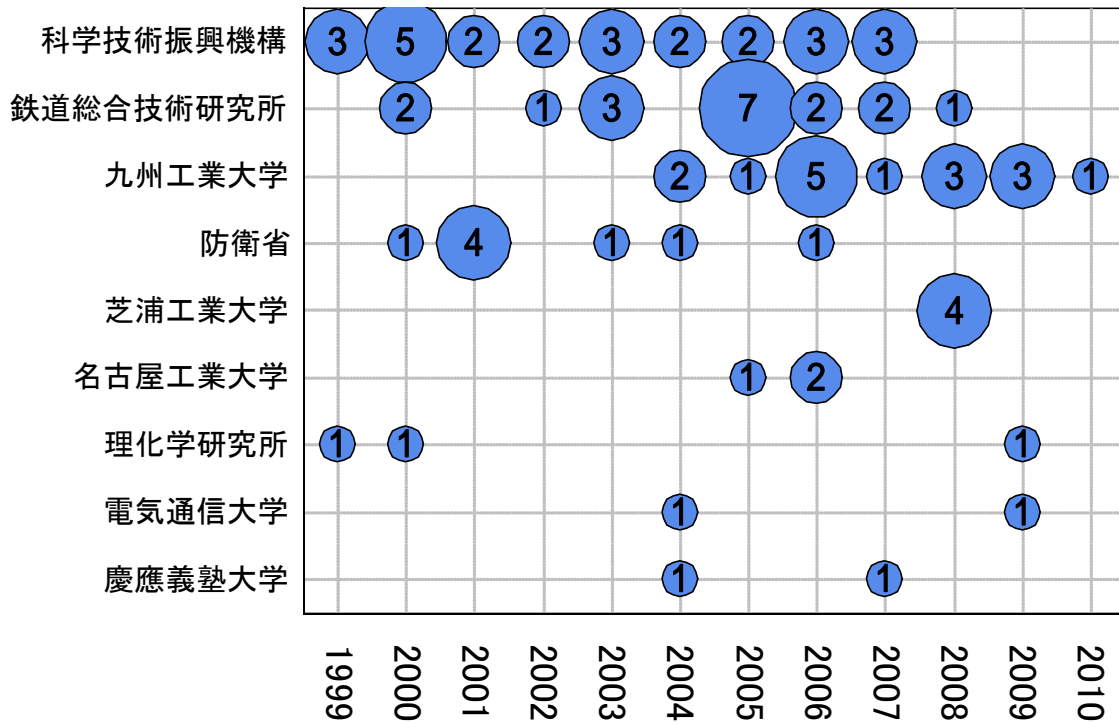
1. NRIサイバーパテント(株)の商用特許データベース「NRIサイバーパテントデスク2」によりデータ取得
(キーワードの検索範囲: 発明の名称+ 要約+ 特許請求の範囲(全請求項))
2. J-STORE掲載の国内公開特許14,854件(データ取得:2012年2月)を対象
3. 日本国内の大学、高専、公的研究機関(独立行政法人、財団法人)による出願特許で、出願日1992.02~2012.01のもの(データ取得:2012年2月)を対象

「J-STORE掲載特許」のマップ上にある数字をクリックすると、当該特許一覧の情報が参照できます(「大学等出願特許」にはリンクはありません)。

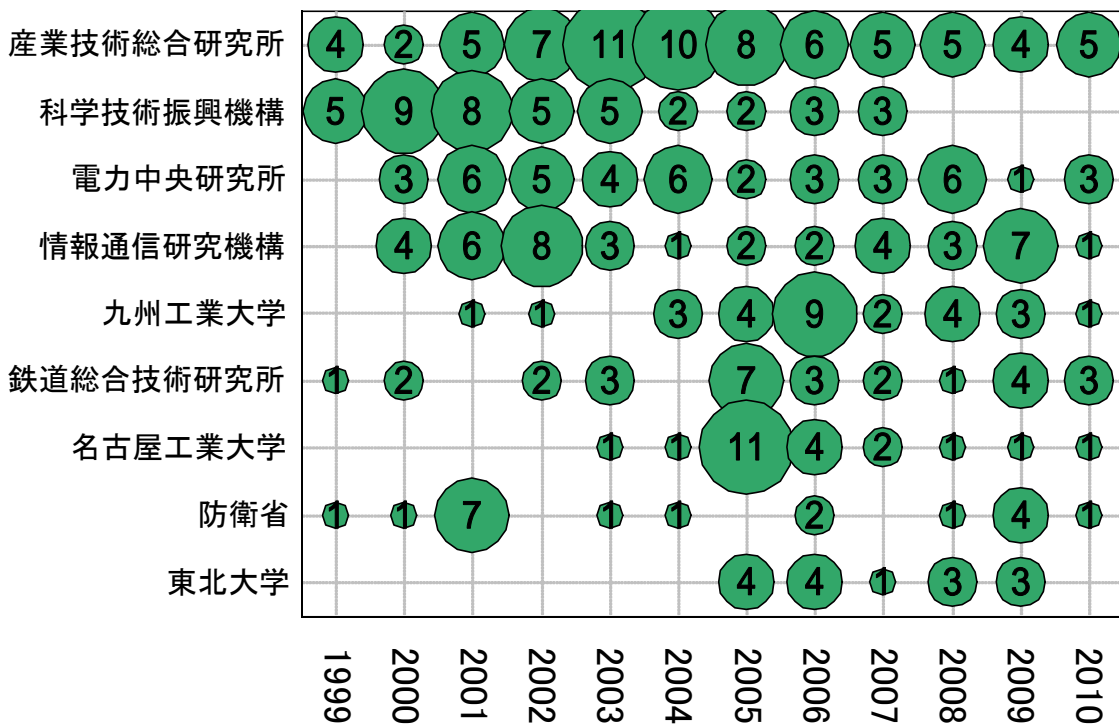
特許マップ作成時との時差の関係上、マップ上の数字(件数)と一覧表示される特許件数が異なることがあります。

出願人別件数推移時系列マップ

【J-STORE搭載特許】

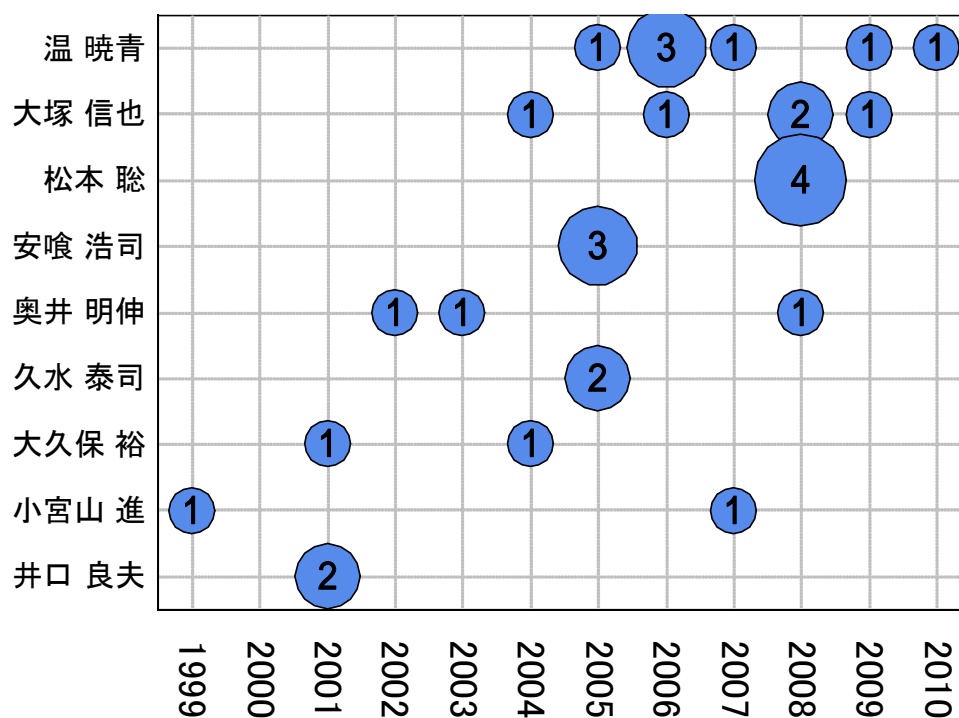


【大学等出願特許】

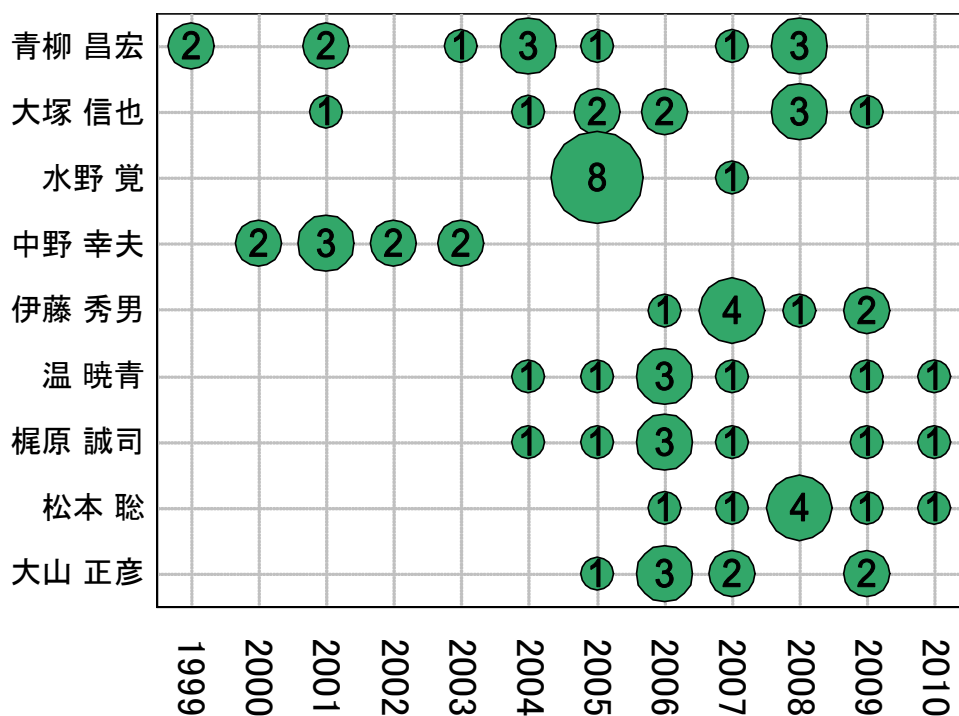


発明者別件数推移時系列マップ

【J-STORE搭載特許】

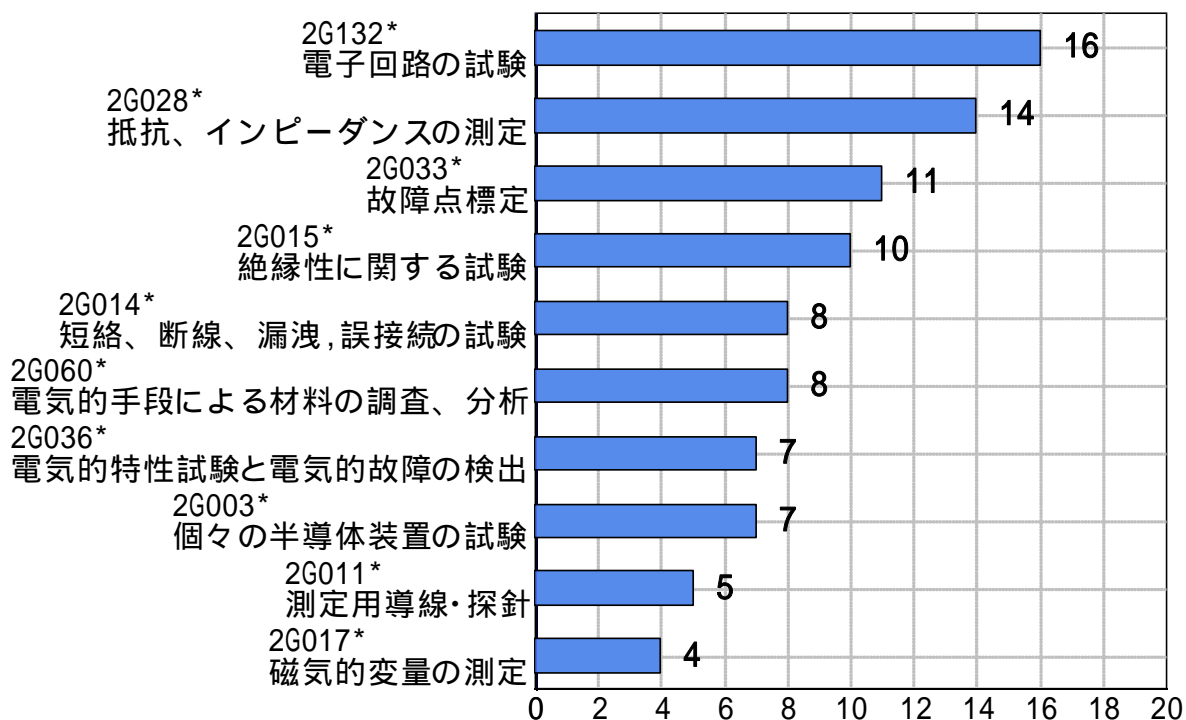


【大学等出願特許】

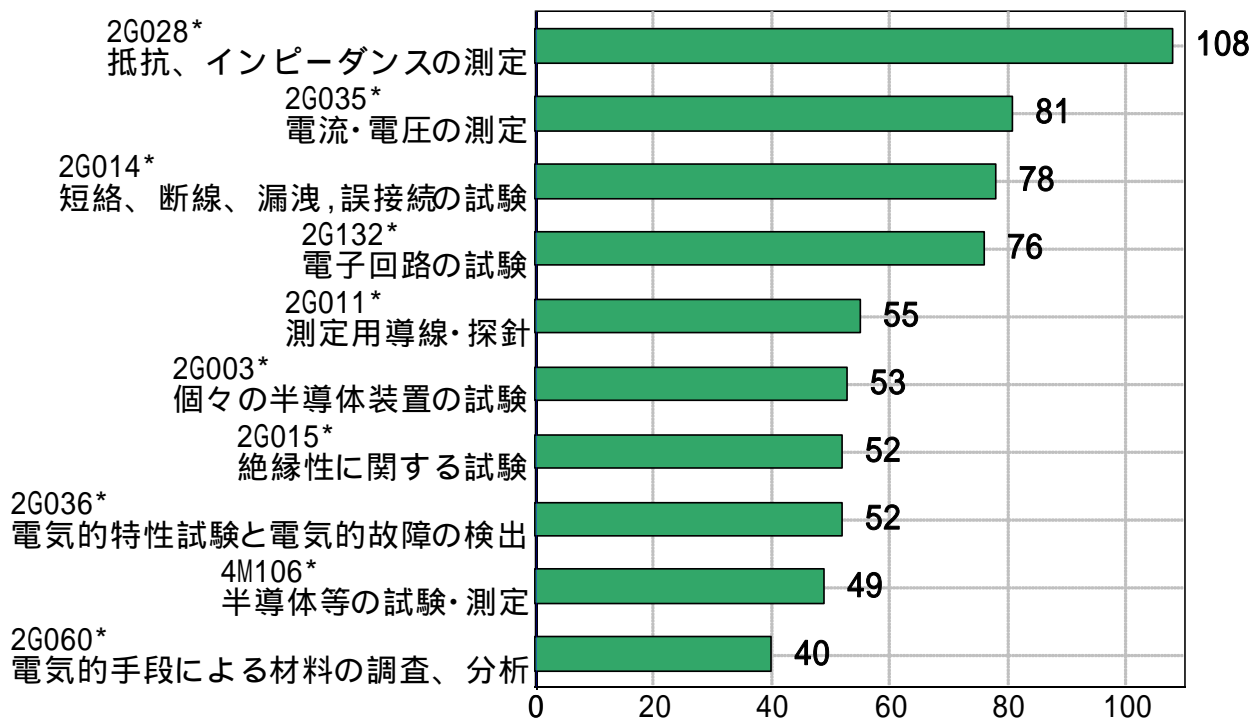


Fターム件数ランキングマップ

【J-STORE搭載特許】

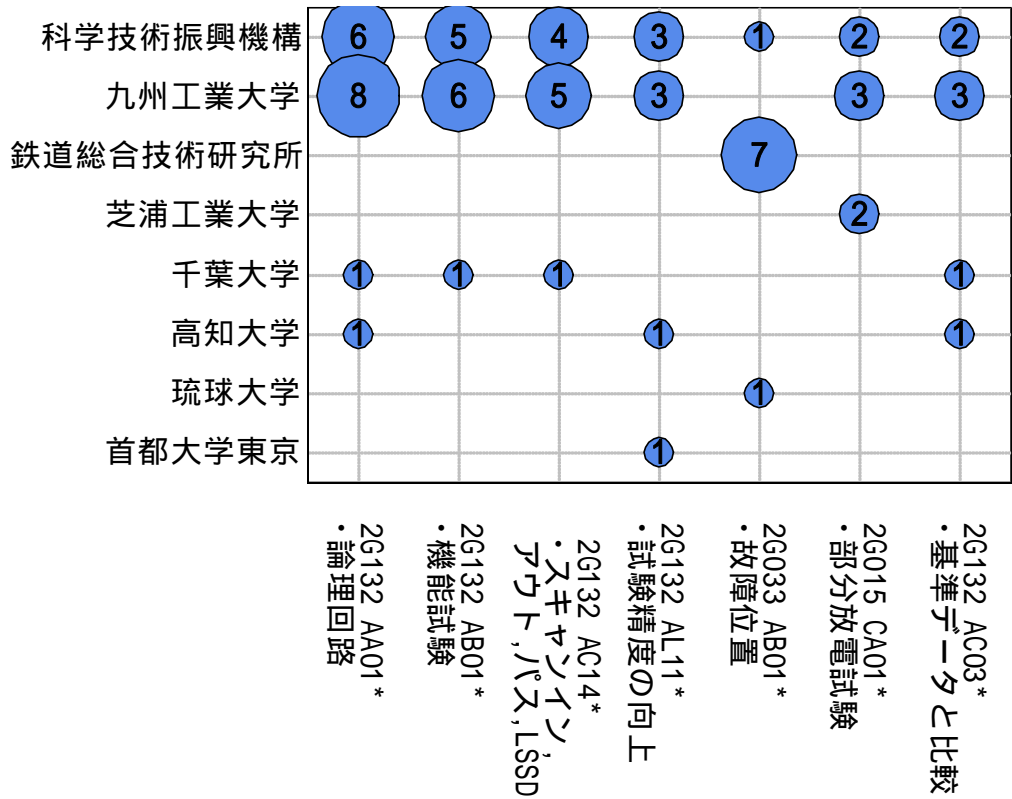


【大学等出願特許】

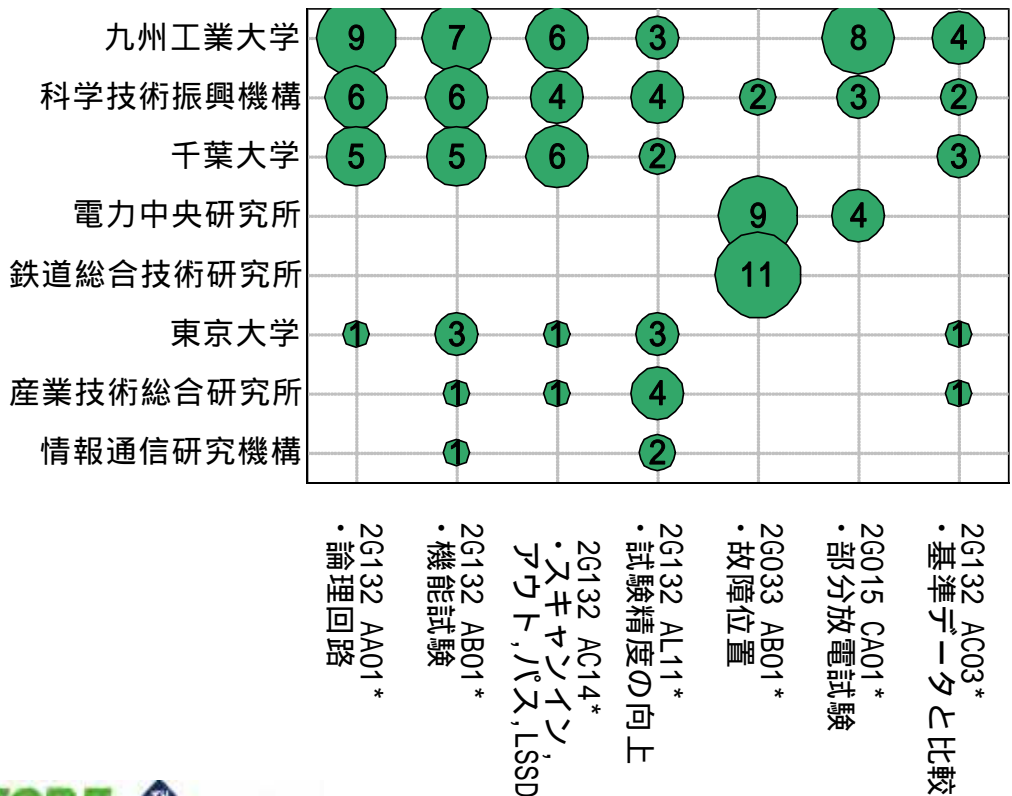


出願人vs. Fタームマトリクスマップ

【J-STORE搭載特許】

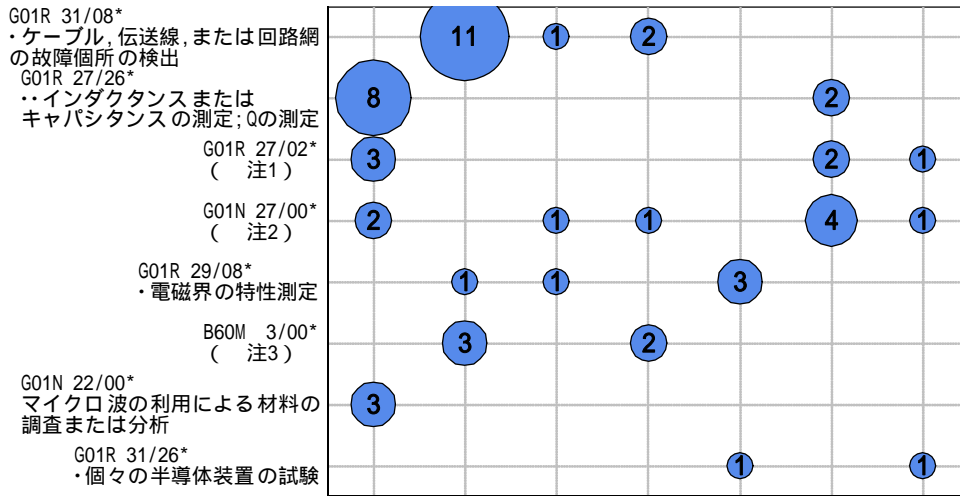


【大学等出願特許】



IPC分類vs. Fタームマトリクスマップ

【J-STORE搭載特許】



2G011*
測定用導線・探針

2G060*
電気的手段による
材料の調査、分析

2G036*
電気的特性試験と
電氣的故障の検出

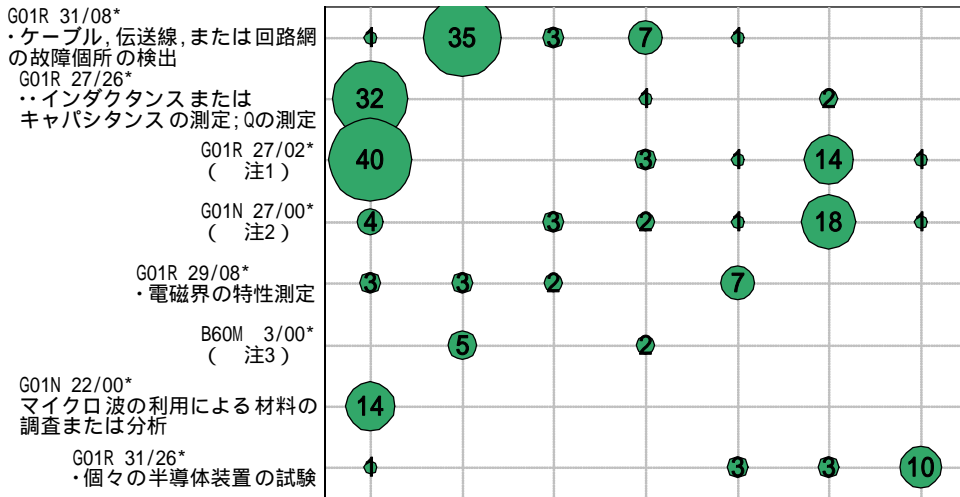
2G014*
短絡、断線、漏洩、
誤接続の試験

2G015*
絶縁性に関する試験

2G033*
故障点標定

2G028*
抵抗、インピーダンスの測定

【大学等出願特許】



2G011*
測定用導線・探針

2G060*
電気的手段による
材料の調査、分析

2G036*
電気的特性試験と
電氣的故障の検出

2G014*
短絡、断線、漏洩、
誤接続の試験

2G015*
絶縁性に関する試験

2G033*
故障点標定

2G028*
抵抗、インピーダンスの測定

(注1) G01R 27/02*
・実数または複素抵抗,リアクタンス,インピーダンス,またはそれらから誘導される二端子特性

(注2) G01N 27/00*
電氣的,電氣化学的,または磁氣的手段の利用による材料の調査または分析

(注3) B60M 3/00*
車両における集電装置に接触する供給線への給電;回生力を消費するための装置